

U D C
内 部



中华人民共和国国家军用标准

GJB 4.4—83

舰船电子设备环境试验 低温贮存试验

1983—01—27发布

1983—10—01实施

国防科学技术工业委员会 批准

目 录

1	试验目的	10
2	试验等级	10
3	试验条件	10
4	试验程序	10
5	合格要求	11
6	有关标准引用本标准时应规定的细则	11

舰船电子设备环境试验低温贮存试验

本标准规定了舰船电子设备的低温贮存试验。它是制订舰船电子设备*总技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。

GJB4.1—83《舰船电子设备环境试验 总则》的规定适用于本标准。

1 试验目的

评定舰船电子设备在低温环境条件下贮存的适应性。

2 试验等级

试验温度: -40°C ;

试验时间: 24小时。

3 试验条件

3.1 对试验设备的要求

3.1.1 试验箱(室)在其工作空间内,应能提供第2条所规定的温度,允许误差为 $\pm 3^{\circ}\text{C}$,可以用强迫通风来保持温度均匀。

3.1.2 试验箱(室)的容积与试验样品之比应不小于5:1。

4 试验程序

4.1 予处理

将试验样品放置在正常大气条件下,使之达到温度稳定。

4.2 初始检测

按有关标准规定对试验样品进行外观检查、电性能和机械性能检测。

4.3 试验

试验样品应处于不包装、不通电和准备工作状态,并按实船使用状态将试验样品放进试验箱(室)内,然后以每分钟不超过 1°C 的速率将试验箱(室)的温度降到 $-40 \pm 3^{\circ}\text{C}$;保温24小时。

4.4 恢复

* 本标准中的舰船电子设备均不含通信设备

试验结束后,对试验样品表面凝结的冰霜及融化的水珠,允许短时间内用试验室温度进行吹风除去,然后在正常大气条件下进行恢复,使之达到温度稳定。

4.5 最后检测

按有关标准规定对试验样品进行外观检查、电性能和机械性能检测。

5 合格要求

由有关标准规定。

6 有关标准引用本标准时应规定的细则

- a. 予处理;
- b. 初始检测的项目和要求;
- c. 试验期间试验样品的状态;
- d. 试验温度和时间;
- e. 恢复;
- f. 最后检测的项目和要求。

附加说明:

本标准由四机部、六机部、海军联合提出。

本标准主要起草人 薛振夷。